



Curso: Metrología avanzada, registrado ante STPS

Incluye:

- ✓ Memorias del curso digitales
- ✓ Bolígrafo
- ✓ Reconocimiento con valor curricular
- ✓ Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)
- ✓ 6 meses de asesoría por email o WhatsApp sin costo
- ✓ Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero

Duración: 24 horas

Instructor: Con más de 10 años de experiencia en metrología.

Objetivos: Al finalizar el curso, el participante conocerá la normativa, conceptos y aplicaciones de la metrología en los laboratorios de ensayo y de calibración.

Requisitos del participante: Conocimientos básicos de metrología, calculadora científica, disponibilidad de instrumentos para curso.

Dirigido a:

- Personal responsable de realizar calibraciones
- Jefes y gerentes de laboratorio
- Jefes y gerentes de calidad y mantenimiento
- Metrólogos y personal técnico
- Signatarios ante la EMA

Temario general.

1. Introducción a la metrología avanzada

- Importancia de la metrología
- Objetivo de la metrología
- Alcance de la metrología
- Aplicación de la metrología
- Conciencia metrológica

2. Terminología NMX-Z-055-IMNC

- Objetivo de la norma
- Alcance de la norma
- Medición
- Calibración
- Error de medición
- Incertidumbre
- Trazabilidad

3. Ley de Infraestructura de la Calidad LIC.

- Metrología
- Normalización
- Acreditación y Aprobación
- Verificación
- Sanciones
- Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad LIC.

4. ISO/IEC 17025:2017

- Objetivo de la norma
- Alcance de la norma
- Requisitos
- Criterios de aplicación de la 17025 EMA

5. Patrones de medición

- Tipos de patrones
- Características de los patrones
- Selección de patrones
- Manipulación de los patrones

6. Incertidumbre de medición NMX-CH-140-IMNC

- Objetivo de la norma
- Alcance de la norma
- Evaluación tipo A de la incertidumbre
- Evaluación tipo B de la incertidumbre
- Incertidumbre combinada u
- Incertidumbre expandida U

7. Trazabilidad de medición

- Evidencia de trazabilidad
- Cartas de trazabilidad

8. Políticas de la EMA

- Política de ensayos de aptitud
- Política de incertidumbre
- Política de trazabilidad



9. Conclusiones de la metrología avanzada

Metodología: 40% teoría – 60 % ejercicios prácticos